

# Rotation de TP - Semestre 8 - 2020-2021

ven. 9 avr.

Groupe TP 1 (mercredis) - 23 élèves

		Séquence 1					Séquence 2						
		mer. 10 févr.	mer. 3 mars	jeu. 4 mars	mer. 10 mars	mer. 17 mars	mer. 24 mars	mer. 31 mars	mer. 7 avr.	mer. 14 avr.	mer. 5 mai	jeu. 6 mai	mer. 12 mai
Séance	CR	jeu. 4 mars	mer. 10 mars	lun. 15 mars	mer. 17 mars	mer. 24 mars	mer. 31 mars	mer. 7 avr.	mer. 14 avr.	mer. 5 mai	jeu. 6 mai		
		Aberrations					DéTECTEURS et bruits					Examen	
TP1.1	A	A1	A2	<b>A3</b>	A4		B1	B2	B3	B4			
TP1.2	B	A2	A3	A4		<b>A1</b>	B2	B3	B4		B1		
TP1.3	C	A3	A4		A1	<b>A2</b>	B3	B4		B1	B2		
TP1.4	D	A4		A1	A2	<b>A3</b>	B4		B1	B2	B3		
TP1.5	E		A1	A2	<b>A3</b>	A4		B1	B2	B3	B4		
		DéTECTEURS et bruits					Aberrations					Examen	
TP1.6		B1	B2	B3	B4		A	A1	A2	<b>A3</b>	A4		
TP1.7		B2	B3	B4		<b>B1</b>	B	A2	A3	A4	<b>A1</b>		
TP1.8		B3	B4		B1	<b>B2</b>	C	A3	A4		A1		<b>A2</b>
TP1.9		B4		B1	B2	<b>B3</b>	D	A4		A1	A2		<b>A3</b>
TP1.10			B1	B2	B3	B4	E		A1	A2	<b>A3</b>	A4	

## Aberrations

Aberrations sur l'axe	<b>A1</b>	<i>S1.10</i>	On-axis aberrations
Aberrations de champ	<b>A2</b>	<i>S1.4</i>	Off-axis aberrations
Zygo	<b>A3</b>	<i>S1.2</i>	Zygo
HASO	<b>A4</b>	<i>S1.8</i>	HASO

## DéTECTEURS et bruits | Detectors and noise.

Bruit dans un système de photodétection	<b>B1</b>	<i>S1.20</i>	Photodetection noise sources
Caractérisation d'un détecteur infrarouge	<b>B2</b>	<i>S1.15</i>	Infrared detector characteristic measurement
Etude d'un capteur CMOS industriel	<b>B3</b>	<i>S1.24</i>	CMOS sensor
Caméra infrarouge	<b>B4</b>	<i>S1.28</i>	Thermal camera

# Rotation de TP - Semestre 8 - 2020-2021

ven. 9 avr.

Groupe TP 2 (mardi) - 20 élèves

## Séquence 1

## Séquence 2

Séance	CR	mar. 9 févr.	mar. 2 mars	mar. 9 mars	jeu. 11 mars	mar. 16 mars	mar. 23 mars	jeu. 25 mars	mar. 30 mars	mar. 6 avr.	mar. 13 avr.	mar. 4 mai	mar. 11 mai
		jeu. 4 mars	mar. 9 mars	mar. 16 mars	jeu. 18 mars	mar. 23 mars	mar. 30 mars	jeu. 1 avr.	mar. 6 avr.	mar. 13 avr.	mar. 4 mai		
		Aberrations					Détecteurs et bruits						
TP2.1	A	A1	A2	A3	A4		B1	B2	B3	B4			Examen
TP2.2	B	A2	A3	A4		A1	B2	B3	B4		B1		
TP2.3	C	A3	A4		A1	A2	B3	B4		B1	B2		
TP2.4	D	A4		A1	A2	A3	B4		B1	B2	B3		
TP2.5	E		A1	A2	A3	A4		B1	B2	B3	B4		
		Détecteurs et bruits					Aberrations						
TP2.6		B1	B2	B3	B4		A	A1	A2	A3	A4		Examen
TP2.7		B2	B3	B4		B1	B	A2	A3	A4		A1	
TP2.8		B3	B4		B1	B2	C	A3	A4		A1	A2	
TP2.9		B4		B1	B2	B3	D	A4		A1	A2	A3	
TP2.10			B1	B2	B3	B4	E		A1	A2	A3	A4	

### Aberrations

Aberrations sur l'axe	<b>A1</b>	<i>S1.10</i>	On-axis aberrations
Aberrations de champ	<b>A2</b>	<i>S1.4</i>	Off-axis aberrations
Zygo	<b>A3</b>	<i>S1.2</i>	Zygo
HASO	<b>A4</b>	<i>S1.8</i>	HASO

### Détecteurs et bruits | Detectors and noise.

Bruit dans un système de photodétection	<b>B1</b>	<i>S1.20</i>	Photodetection noise sources
Caractérisation d'un détecteur infrarouge	<b>B2</b>	<i>S1.15</i>	Infrared detector characteristic measurement
Etude d'un capteur CMOS industriel	<b>B3</b>	<i>S1.24</i>	CMOS sensor
Caméra infrarouge	<b>B4</b>	<i>S1.28</i>	Thermal camera

# Rotation de TP - Semestre 8 - 2020-2021

ven. 9 avr.

Groupe TP 3 (lundi) - 21 élèves

## Séquence 1

## Séquence 2

Séance	CR	Aberrations	Détecteurs et bruits	Aberrations	Détecteurs et bruits
		lun. 8 févr. jeu. 11 févr. lun. 1 mars lun. 8 mars lun. 15 mars		lun. 22 mars lun. 29 mars jeu. 1 avr. jeu. 8 avr. lun. 12 avr.	lun. 10 mai
		lun. 1 mars jeu. 4 mars lun. 8 mars lun. 15 mars lun. 22 mars		lun. 29 mars lun. 5 avr. jeu. 8 avr. jeu. 15 avr. lun. 3 mai	
TP3.1	A	A1, A2, <b>A3</b> , A4	B1, B2, B3, B4	A1, A2, <b>A3</b> , A4	Examen
TP3.2	B	A2, A3, A4, <b>A1</b>	B2, B3, B4, B1	A2, A3, A4, <b>A1</b>	
TP3.3	C	A3, A4, A1, <b>A2</b>	B3, B4, B1, B2	A3, A4, A1, <b>A2</b>	
TP3.4	D	A4, A1, A2, <b>A3</b>	B4, B1, B2, B3	A4, A1, A2, <b>A3</b>	
TP3.5	E	A1, A2, <b>A3</b> , A4	B1, B2, B3, B4	A1, A2, <b>A3</b> , A4	
TP3.6		B1, B2, B3, B4	A1, A2, <b>A3</b> , A4	A1, A2, <b>A3</b> , A4	Examen
TP3.7		B2, B3, B4, B1	A2, A3, A4, <b>A1</b>	A2, A3, A4, <b>A1</b>	
TP3.8		B3, B4, B1, B2	A3, A4, A1, <b>A2</b>	A3, A4, A1, <b>A2</b>	
TP3.9		B4, B1, B2, B3	A4, A1, A2, <b>A3</b>	A4, A1, A2, <b>A3</b>	
TP3.10		B1, B2, B3, B4	A1, A2, <b>A3</b> , A4	A1, A2, <b>A3</b> , A4	

### Aberrations

Aberrations sur l'axe	<b>A1</b>	<i>s1.10</i>	On-axis aberrations
Aberrations de champ	<b>A2</b>	<i>s1.4</i>	Off-axis aberrations
Zygo	<b>A3</b>	<i>s1.2</i>	Zygo
HASO	<b>A4</b>	<i>s1.8</i>	HASO

### Détecteurs et bruits | Detectors and noise.

Bruit dans un système de photodétection	<b>B1</b>	<i>s1.20</i>	Photodetection noise sources
Caractérisation d'un détecteur infrarouge	<b>B2</b>	<i>s1.15</i>	Infrared detector characteristic measurement
Etude d'un capteur CMOS industriel	<b>B3</b>	<i>s1.24</i>	CMOS sensor
Caméra infrarouge	<b>B4</b>	<i>s1.28</i>	Thermal camera